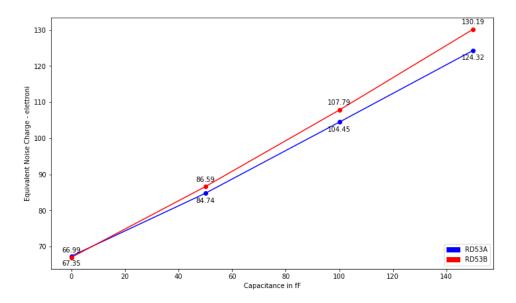
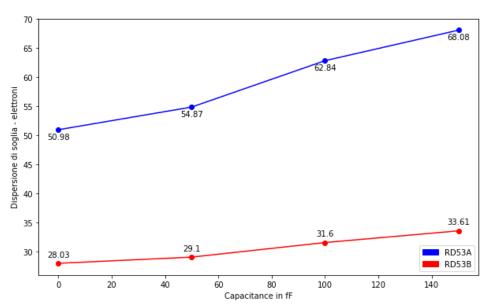
Analisi del comportamento di ENC e Dispersione di soglia al variare di C_D e I_LKG_N. Stiamo simulando il comportamento dei FE con sensori che hanno subito dosi elevate di irraggiamento, quindi usurati e che, dunque, mostrano effetti parassitari non trascurabili.

Capacità C_D

ENC in funzione della capacità C_D soglia 1500 elettroni



Dispersione di soglia in funzione della capacità C_D soglia 1500 elettroni



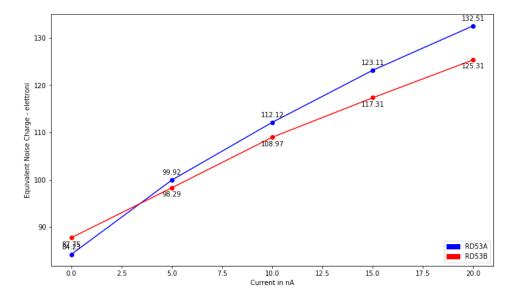
Chiaramente si nota che il noise aumenta all'aumentare del valore di $C_{\scriptscriptstyle D}$. Inoltre, sembra che RD53B sia leggermente più rumoroso.

La dispersione di soglia per il RD53B è nettamente migliore (inferiore di un fattore 2) rispetto al RD53A. Inoltre l'effetto delle capacità sulla dispersione di soglia è apprezzabile, soprattutto per il tipo A. In prima approssimazione, dunque, l'effetto della capacità di ingresso sulla dispersione di soglia del tipo B è trascurabile.

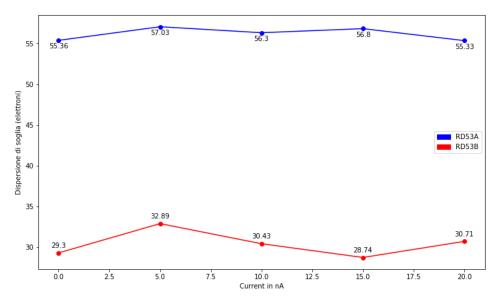
Corrente I_LKG_N

La capacità CD è impostata a 50 fF

ENC in funzione della corrente di leakage (I_{LDAC} 14 μ A)



Dispersione di soglia in funzione della corrente di leakage



Il rumore di entrambi i FE cresce al crescere della corrente di leakage. In questo caso si nota che RD53A sia leggermente più sensibile del RD53B.

La dispersione di soglia non è influenzata dalla presenza di correnti di leakage.

Prestazioni

Possiamo valutare le prestazioni del FE calcolando un parametro che aggrega i valori di dispersione di soglia $\sigma_{_{Vth}}$ ed Equivalent Noise Charge in un unico dato:

$$p = \sqrt{(ENC^2 + \sigma_{Vth}^2)}$$

Calcolando le prestazioni per ogni misurazione fatta e plottando i dati in funzione di corrente di leakage e di capacità C_D , otteniamo:

